

「画像解析による粒子計測 ～基礎から応用まで～」 + 画像解析式粒度分布測定装置・実演」

2025年

6月13日 (金) 13:30～16:15

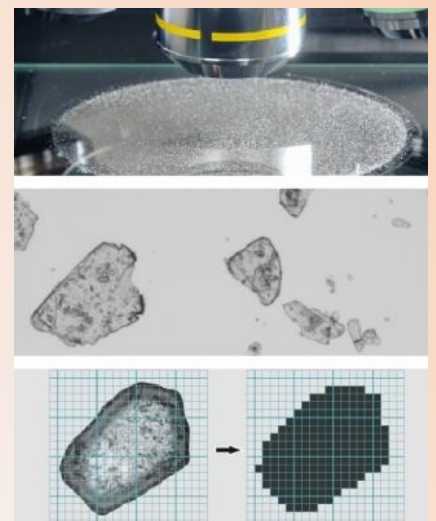
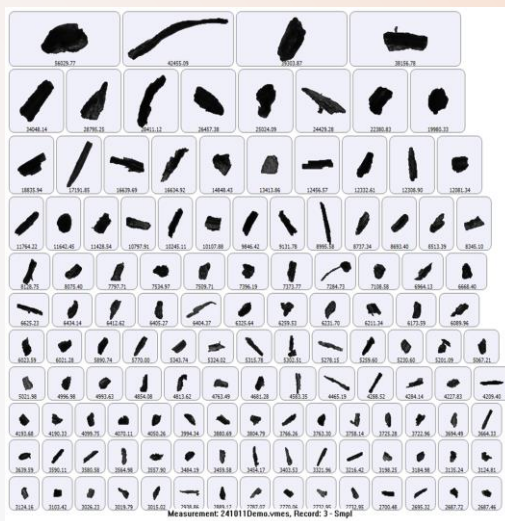
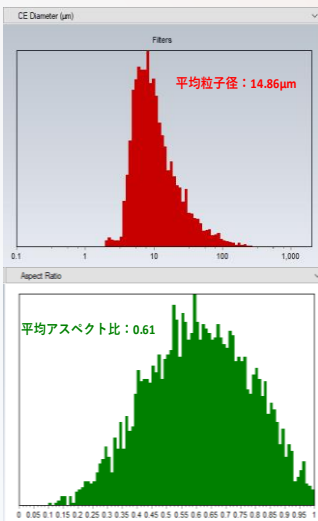
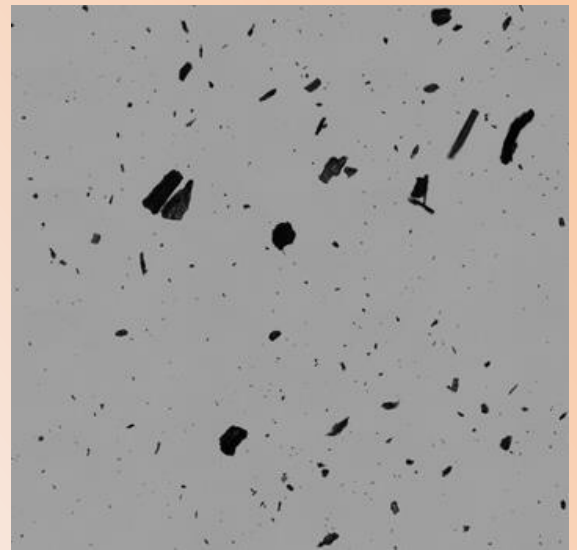
佐賀県工業技術センター 本館1階 技術研修室

参加費
無料

佐賀県工業技術センターでは、次世代型の画像解析式粒度分布測定装置を新たに導入しました。

この装置では、数万個以上の大量の粒子画像から全自動で粒子径と形状を処理し、高精度の分析結果を提供します。

画像解析による粒子計測の原理や特徴、応用例についてセミナーを開催します。装置による測定の実演も実施します。



●画像解析による粒子計測とは

食品・コスメ分野において、粒子の大きさや形状は製品の舌触りや喉ごし、使い心地などの品質に大きく関わり、粒子計測は重要な分析技術です。顕微鏡で撮影した画像の解析による粒子計測は、ISOにも記載された手法ですが、近年の情報処理技術の発達に伴い、高精度かつ迅速に測定できるようになりました。

画像解析による粒子計測により、粒子径分布だけでなく、粒子の形状（球状、棒状、繊維状など）が計測できます。このことは、粒子の不均一性や形状-品質の関係把握、異物の解析等に大きな力を発揮します。

画像解析による粒子計測により、次のような解析が可能です。

- 野菜パウダー等の粉末加工品のサイズ・形状解析
- 異物粒子の形状・個数解析
- 乳化状態、乳化粒子径の解析

このセミナーでは、画像解析による粒子計測の原理や特徴、応用例について、測定の実演を交えながら紹介します。

1. 日時

2025年6月13日（金） 13:30～16:15

2. 場所

佐賀県工業技術センター 本館1階 技術研修室
（佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114）

3. プログラム

13:30～14:30 第1部 画像解析による粒子計測 ～基礎と応用～

14:45～16:15 第2部 画像解析式粒度分布測定装置（Malvern Panalytical
モフォロギ4）による測定の実演

講師：スペクトリス株式会社 マルバーン・パナリティカル事業部 笹倉大督 博士

4. 参加料

無料

5. 定員

先着30名（お申込が多数のときは、県内関係者を優先致します）

6. お申込【期限：2025年6月10日(火)】

下記URL、もしくは右のQRコードにアクセスし、
フォームからお申し込みください。

<http://logoform.jp/form/jbBd/1032092>

※ご提供いただきました個人情報、係る事務および参加者との連絡においてのみ使用し、その他の目的のために使用することはありません。



7. お問い合わせ先

佐賀県工業技術センター 食品コスメ部 柘植（つげ） TEL 0952-30-8162
E-Mail food_rds-sec@pref.saga.lg.jp



モフォロギ4